

ULVAC-PHI의 표면분석장비 소개 및 신개발 동향

신용수

우신크라이오백(주)

당사에서 Sales 및 Service를 수행하고 있는 세계적인 명성의 ULVAC-PHI사의 표면분석장비류의 개략적인 소개와 함께 최근 반도체, LCD, 신소재 및 Bio분야의 요구에 따라 개발된 최신 표면분석장비의 특성 및 경향에 대한 정보를 드립니다.

특히 ULVAC-PHI사에서 생산하고 있는 대표적 표면분석장비인 XPS, AES, TOF-SIMS 및 Dynamic SIMS의 아래와 같은 특징에 대한 연구 고찰을 하고자 합니다.

- AES : CMA technology / 7mm Resolution
- XPS : Scan & Focussed X-ray beam technology with small area XPS Analysis
- TOF-SIMS : Robotic sample transfer / LMIG development and C₆₀ ion source